

## ДУКРАТНОЕ РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ НА ТОНКИХ МИШЕНЯХ

В.Н. Б о н д а р е н к о

При анализе состава и структуры твердого тела широко применяется метод резерфордского обратного рассеяния (РОР) [1]. Начиная с работы [2], для описания низкоэнергетической области спектра РОР на тонкой мишени используется численное моделирование, основанное на концепции двукратного рассеяния. В рамках модели двукратного рассеяния нам удалось получить ряд аналитических выражений, позволяющих существенно ускорить процесс расчета спектра в данной области.

Предварительно рассмотрим схему рассеяния в сферических координатах, где ось  $Z$  направлена вдоль нормали к поверхности мишени (см. рисунок). Ион с энергией  $E_0$ , падающий на мишень в плоскости  $XOZ$  под углом  $\varphi_1$  к нормали, на глубине  $z$  тормозится до энергии  $E_1$ . На глубине  $z$  ион может испытать однократное рассеяние непосредственно в направлении детектора, расположенного также в плоскости  $XOZ$  под углом  $\varphi_2$  к нормали. Альтернативой является рассеяние иона на угол  $\theta_1$  с последующим торможением до энергии  $E_2$  на участке траектории длиной  $r$  и второе рассеяние на угол  $\theta_2$  уже в направлении детектора с последующим торможением до энергии  $E$  на выходном участке траектории. При этом

$$\cos \theta_1 = \cos \varphi \sin \alpha \sin \varphi_1 + \cos \alpha \cos \varphi_1, \quad (1a)$$

$$\cos \theta_2 = \cos \varphi \sin \alpha \sin \varphi_2 - \cos \alpha \cos \varphi_2, \quad (16)$$

где  $\varphi$  - азимутальный, а  $\alpha$  - полярный углы направления первого рассеяния. Величины  $E_1 = E_1(z)$ ,  $r = r(E, z, \varphi, d)$ ,  $E_2 = E_2(E, z, \varphi, d)$  в неявном виде определяются системой уравнений:

$$\frac{z}{\cos \varphi_1} = \int_{E_1}^{E_0} \frac{dE}{S(E)} \quad (2a), \quad r = \int_{E_2}^{E_1} \frac{dE}{S(E)} \quad (2b), \quad \frac{z + r \cos \alpha}{\cos \varphi_2} = \int_E^{E_2} \frac{dE}{S(E)} \quad (2b),$$

где  $S(E)$  - тормозная способность вещества мишени, являющаяся функцией энергии  $E$ ,

$$k(\theta) = \left( \frac{\frac{M_1}{M_2} \cos \theta + \sqrt{1 - \left(\frac{M_1}{M_2} \sin \theta\right)^2}}{1 + \frac{M_1}{M_2}} \right)^2 \quad (3)$$

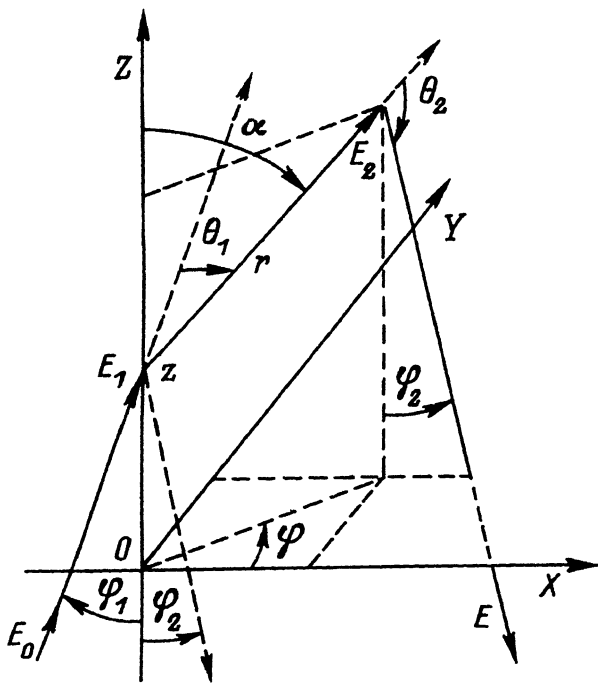


Схема двукратного рассеяния.

кинематический фактор упругого рассеяния на угол  $\theta$  для иона с массой  $M_1$  на атоме вещества с массой  $M_2$ .

Рассматривая все возможные траектории двукратного рассеяния иона с заданной энергией  $E$  на выходе из мишени, приходим к следующему выражению для выхода  $\Delta N_2$  двукратного рассеяния в интервале энергий от  $E$  до  $E + \Delta E$  в низкоэнергетической области, запрещенной для однократного рассеяния:

$$\Delta N_2(E) = \frac{2N_0 n^2 \Delta \Omega \Delta E}{\cos \varphi_1 S(E)} \int_0^1 dz \int_{\alpha_{\min}(E, z, \varphi)}^{\alpha_{\max}(E, z, \varphi)} d\alpha \frac{\sigma(E_1, \theta_1) \sigma(E_2, \theta_2) \sin \alpha d\alpha}{\left[ \frac{\cos \alpha}{\cos \varphi_2} + k(\theta_2) \frac{S(E_2)}{S(k(\theta_2)E_2)} \right]}, \quad (4)$$

где  $N_0$  — общее число ионов, упавших на мишень,  $n$  — плотность атомов мишени,  $l$  — толщина мишени,  $\Delta \Omega$  — телесный угол детектора,  $\sigma(E, \theta)$  — дифференциальное сечение упругого рассеяния иона с энергией  $E$  на угол  $\theta$  в лабораторной системе. Пределы интегрирования по  $\alpha$  определяются уравнениями:

$$r(\alpha_{\min}) \cos \alpha_{\min} + z = l \quad (5a), \quad r(\alpha_{\max}) \cos \alpha_{\max} + z = 0 \quad (5b).$$

В зависимости от условий эксперимента в качестве сечения в общем выражении (4) можно использовать либо сечение, основанное на экранированном кулоновском потенциале, либо классическое резерфордовское сечение, имеющее в лабораторной системе следующий вид:

$$\sigma(E, \theta) = \left( \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2E} \right)^2 g(\theta), \quad g(\theta) = \frac{\left(1 + \frac{M_1}{M_2}\right)^2 k(\theta)}{\sqrt{1 - \left(\frac{M_1}{M_2} \sin \theta\right)^2} \left(1 - \cos \theta \sqrt{k(\theta)}\right)^2}, \quad (6)$$

где  $Z_1$  - атомный номер иона,  $Z_2$  - атомный номер атома мишени,  $e$  - заряд электрона, а фактор  $g(\theta)$  описывает угловую часть сечения. В этом случае

$$\Delta N_2(E) = \frac{N_0 n^2 (Z_1 Z_2 e^2)^4 \Delta \Omega \Delta E}{8 \cos \varphi_1 S(E)} T(E, l), \quad (7)$$

где

$$T(E, l) = \int_0^l \frac{dz}{E_1^2} \int_0^\pi d\varphi \int_{\alpha_{\min}(E, z, \varphi)}^{\alpha_{\max}(E, z, \varphi)} \frac{g(\theta_1) g(\theta_2) \sin \alpha d\alpha}{E_2^2 \left[ \frac{\cos \alpha}{\cos \varphi_2} + k(\theta) \frac{S(E_2)}{S(k(\theta_2) E_2)} \right]}. \quad (8)$$

Наиболее наглядный вид выражение (8) принимает при  $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ ;  $S = \text{const}$ ;  $\frac{M_1}{M_2} \rightarrow 0$ . В этом случае

$$T(E, l) = \frac{\pi}{S E_0^3} \tau \left( \frac{E}{E_0}, \frac{Sl}{E_0} \right), \quad (9)$$

где

$$\tau(\varepsilon, \lambda) = \frac{\ln \left( \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon_{\max} - \varepsilon} \right)}{(1 + \varepsilon)^2} \left\{ \frac{\lambda}{4\varepsilon(\varepsilon + \lambda)} + \frac{\lambda}{4(1 - \lambda)} + \frac{\ln \left[ \frac{\varepsilon + \lambda}{\varepsilon(1 - \lambda)} \right]}{(1 + \varepsilon)} \right\} + \frac{\lambda}{(1 - \varepsilon^2)(\varepsilon_{\max} - \varepsilon)} \left\{ \frac{\lambda}{2\varepsilon(\varepsilon + \lambda)} - \frac{\lambda}{2(1 - \lambda)} + \frac{\ln \left[ \frac{\varepsilon}{(\varepsilon + \lambda)(1 - \lambda)} \right]}{(1 + \varepsilon)} \right\}, \quad (10)$$

причем  $0 < \lambda < \frac{1}{2}$ ,  $0 < \varepsilon < \varepsilon_{\max} \equiv 1 - 2\lambda$ . Функция  $\tau$  имеет  $U$ -образную форму зависимости от  $\varepsilon$  и расходится при  $\varepsilon \rightarrow 0$  и  $\varepsilon \rightarrow \varepsilon_{\max}$ , что является следствием расходимости резерфордовского сечения (6) соответственно при  $E \rightarrow 0$  и  $\theta \rightarrow 0$ . Учет экранировки снимает эти расходимости. При малых (случай небольших толщин мишеней)  $\tau \approx \lambda^2 / (\varepsilon^2 (\varepsilon_{\max} - \varepsilon))$  с минимумом при  $\varepsilon = 2\varepsilon_{\max} / 3$ , что прямо под-

тверждает эмпирическую закономерность, выявленную в работе [2]. Выражения (7, 9, 10) можно использовать для быстрого расчета, если  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  невелики, а тормозная способность слабо изменяется в используемом интервале энергий. В прочих случаях лучше использовать исходные выражения (4, 7, 8).

Анализ полученных выражений показывает, что выход двукратного рассеяния значительно чувствительнее к  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $E_0$ , чем выход однократного рассеяния. Это подтверждают и предварительные эксперименты.

Автор признателен В.Я. Колоту и Н.П. Дикому за полезные обсуждения.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] C h u W.K., M a y e r I.W., N i c o l e t M.-A. et al. // Thin. Solid. Films. 1973. V. 17. P. 1-41.  
[2] W e b e r A., M o m m s e n H., S a r t e r W. and W e l l e r A. // Nucl. Instr. and Methods. 1982. V. 198. P. 527-533.

Харьковский  
физико-технический  
институт АН УССР

Поступило в Редакцию  
2 декабря 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 4  
02; 04; 07

26 февраля 1989 г.

#### РОЛЬ БУФЕРНОГО ГАЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНЫХ СРЕД SPER-ЛАЗЕРА

В.В. А п о л л о н о в, А.В. Е р м а ч е н к о,  
А.А. С и р о т к и н

В [1-4] предложен новый тип лазера с сегментированным возбуждением паров металлов импульсным электрическим разрядом и последующей рекомбинацией (SPER-лазер). Авторы [1-4] полагают, что инверсия на переходах атомов и ионов в данном типе лазера формируется в результате рекомбинации ионов более высокой кратности при разлете плазмы паров металла в буферный газ. При этом роль буферного газа сводится только к столкновительному охлаждению электронов для обеспечения интенсивной рекомбинации. В этом случае увеличение давления  $P$  буферного газа должно приводить к возрастанию интенсивности излучения SPER-лазера, однако генерация на переходах атомов и ионов [4-5] наблюдается в очень узком диапазоне давлений буферного газа. С другой стороны, в [6] показано, что разлет плазмы осуществляется не в холодный,